

2013年8月27日

LPDDR3 用高速テストシステムを開発

開発成果を IEEE SWTW2013(San Diego)にて発表いたしました。

株式会社テラプローブ（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長兼 CEO：渡辺雄一郎）はこのたびエルピーダメモリ株式会社、フォームファクター株式会社、株式会社アドバンテストと共同開発で高速化の進むモバイルメモリ向けの高速テストシステムの開発に成功し、その開発結果を IEEE SWTW2013にて発表いたしました。

近年、モバイルメモリは LPDDR2(533MHz)から LPDDR3(800MHz)に高速化が進んでいます。このたび開発した高速テストシステムによって、従来不可能であった LPDDR3 の高速測定が可能となり、より品質の高い KGD の供給が可能となります。

以上

関連リンク

学会 HP <http://www.swtest.org>発表資料 http://www.swtest.org/swtw_library/2013proc/PDF/SWTW13-8.pdf

●本件に関するお問い合わせ先

株式会社テラプローブ

コーポレートプランニング・IR 部門 松本／小西

電話：045 - 476 - 5711

E-Mail：ir@teraprobe.com